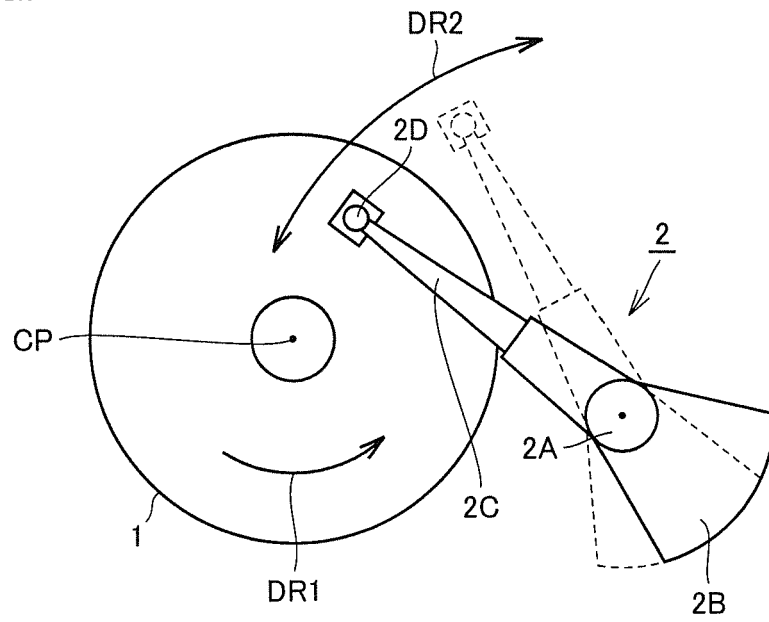


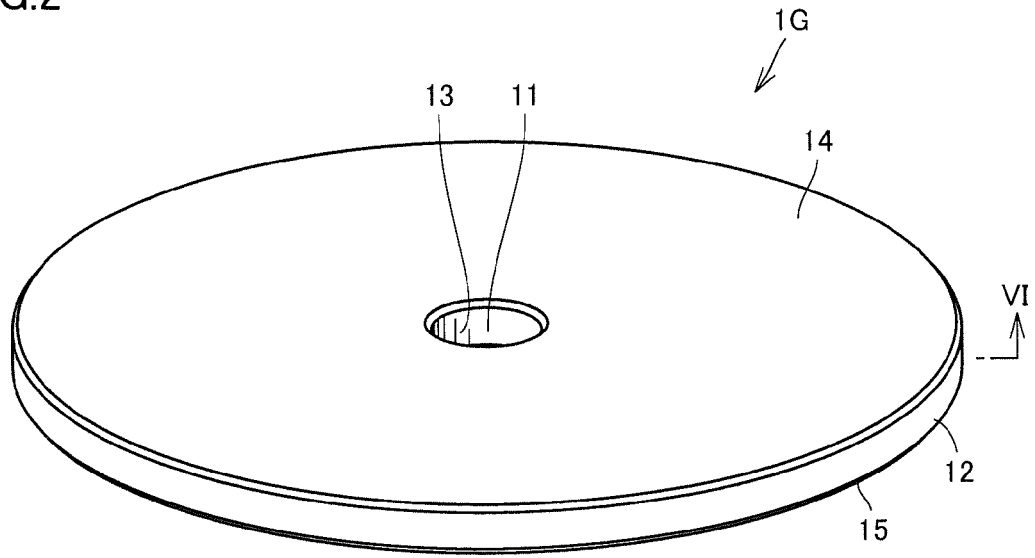
[図1]

FIG.1



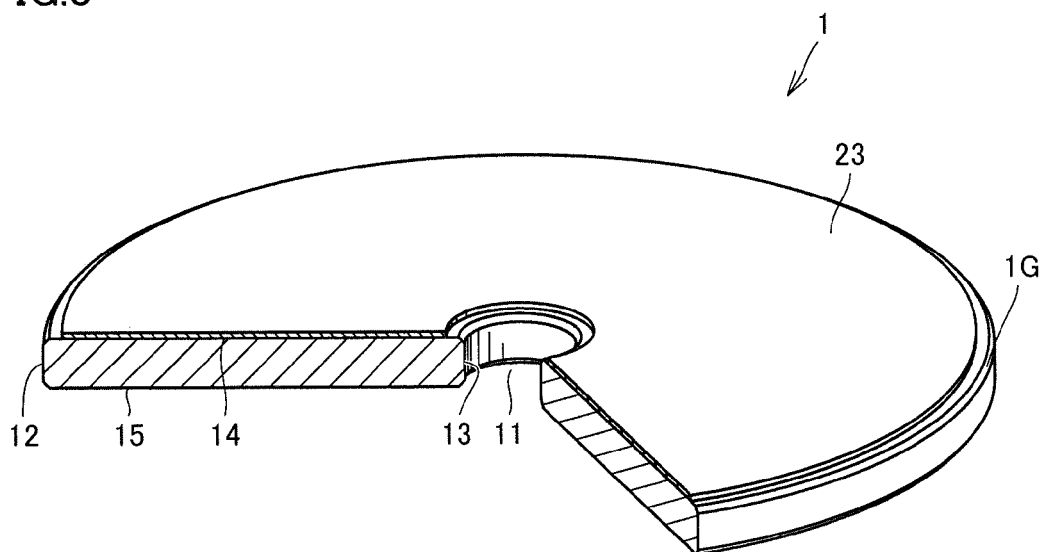
[図2]

FIG.2



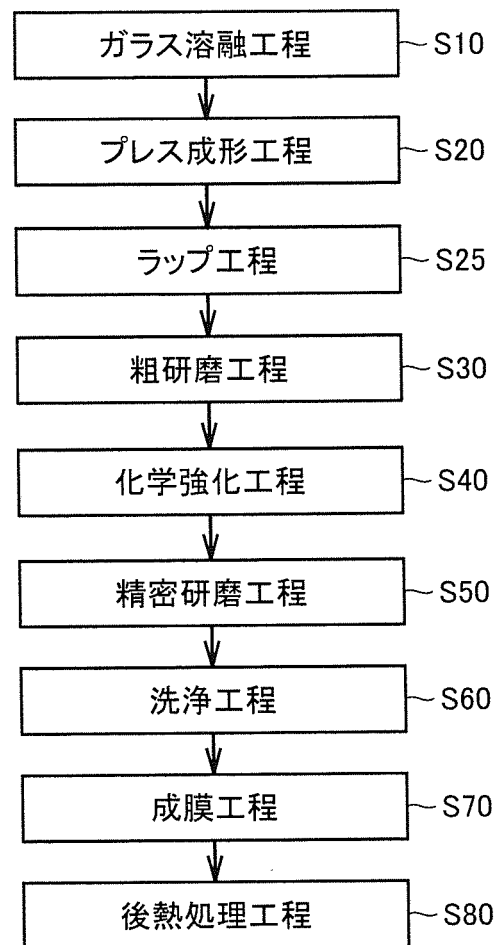
[図3]

FIG.3



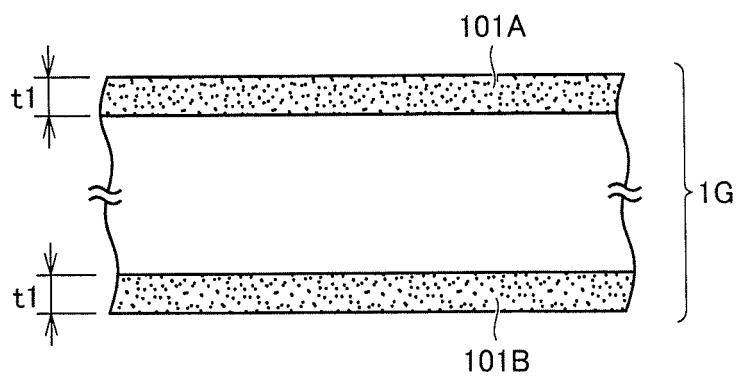
[図4]

FIG.4



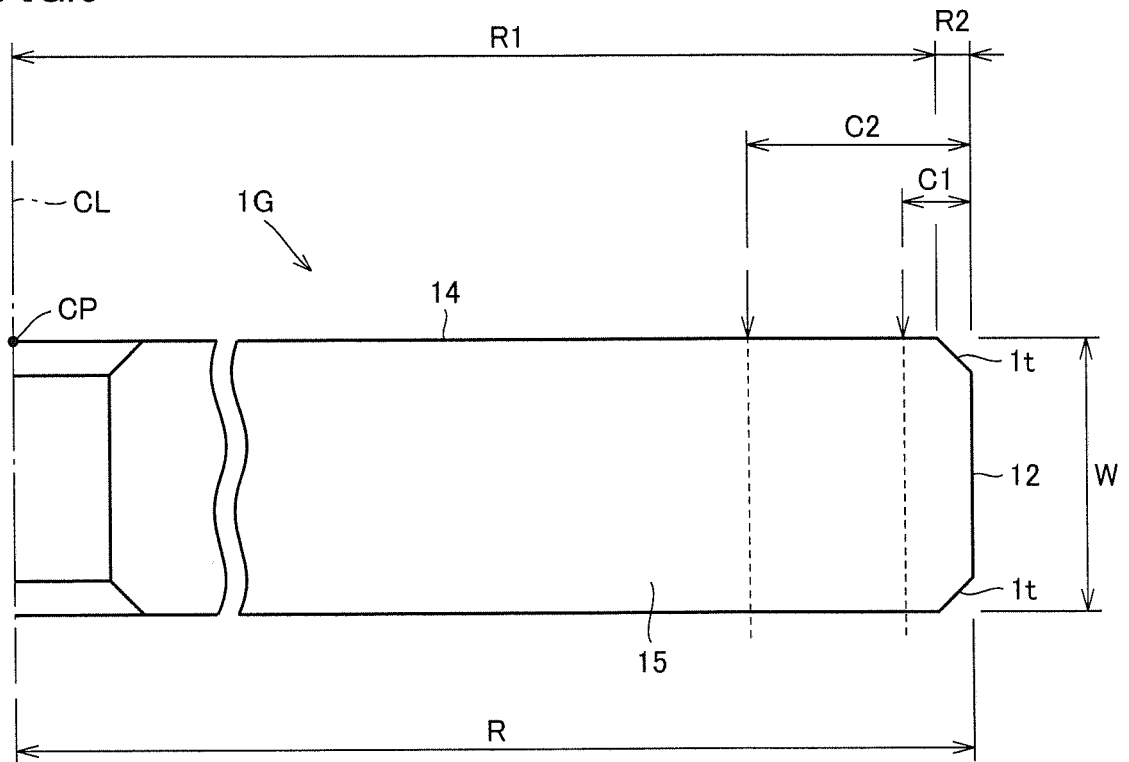
[図5]

FIG.5



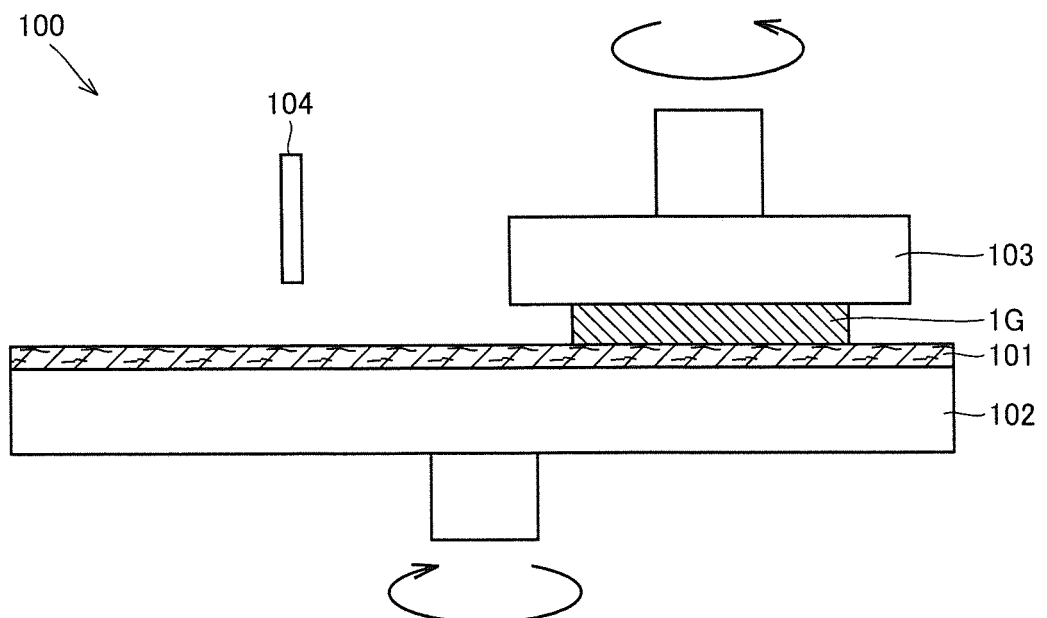
[図6]

FIG.6



[図7]

FIG.7



[図8]

FIG.8

	第1円周領域に おける第1研磨量差 (P1) (μ m)	第2円周領域に おける第2研磨量差 (P2) (μ m)	浮上テスト(1) 外周端面から 6.5mm位置 浮上高さ20nm	浮上テスト(2) 外周端面から 6.5mm位置 浮上高さ5nm	浮上テスト(3) 外周端面から 2.5mm位置 浮上高さ5nm	備考
実施例1	0.05	0.04	A	A	A	内外周良
比較例1	0.12	0.08	A	A	B	内周は良
比較例2	0.17	0.09	A	A	C	外周不良
比較例3	0.21	0.14	A	C	C	外周不良
比較例4	0.35	0.25	C	C	C	内外周不良

※片面加工により取り代の差を発生させている

※A＝両テスト合格、B＝25度テスト合格／70度テスト不合格、C＝両テスト不合格

[図9]

FIG.9

